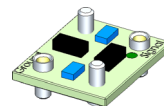




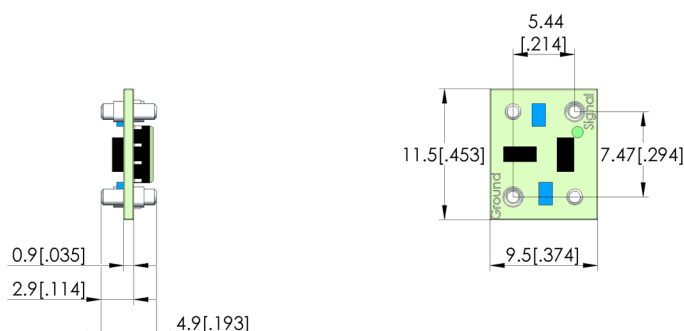
- Componentes para opens test, para prueba capacitiva de chips semiconductores por rupturas, cortocircuitos y errores de soldadura
- Adecuado para sistemas de prueba Teradyne

### Utilización

La placa electrónica FrameScan FX 2.0 se utiliza para pruebas capacitivas de circuitos integrados, para probar las conexiones unidas por cables al interior de un circuito integrado respecto a roturas, cortocircuitos y errores de soldadura.



1:1



### Datos generales

Grupo de productos:	Opens Test
Serie:	OTC
Tipo:	Teradyne opens test
Modelo:	FrameScan FX 2.0
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	Placa de electrónica
Ancho:	9,5 mm
Altura:	4,9 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):	VA 20xx
Juegos de recambio (WS):	WS Teradyne/TSH5x

### Datos técnicos

Longitud:	11,5 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	9,5 x 11,5 x 4,9 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

